

Современные аналитические методы в материаловедении

15 февраля. 11:00

Продолжительность: 2-3 часа

Темы семинара:

- Современные достижения в области электронной микроскопии для материаловедения. Сканирующая микроскопия, двулучевая микроскопия и просвечивающая микроскопия.
- Микротомография. Современное ПО для обработки данных микро- и нанотомографии, расчет физических характеристик (проницаемость, тепло- и электропроводность).
- Малоугловое рентгеновское рассеяние и дифрактометрия. Изучение структурных параметров в диапазоне масштабов 1-200 нм.
- Применение вторично-ионной масс-спектрометрии для исследования и разработки микро- и нанoeлектроники.
- Применение современной рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для исследования состава и строения поверхности различных материалов
- Времяразрешенная флуоресцентная микроскопия и спектроскопия. FLIM, FRET, Single photon counting.

Организатор: Компания Техноинфо

Место проведения: Научно-исследовательский комплекс (НИК), СПбПУ

Контакты организаторов: Евгений Микулинский, тел. +7 926 663-90-80, e-mail:

e.mikulinsky@technoinfo.ru.



PICOQUANT



Exploring the very small

